

X 出版物

1. 利用報告書

1-1 2006 年度

トライアル利用

実験名	実験責任者
Pd-Cu-Si 系金属ガラス合金の構造解析	松下電工株式会社 高濱孝一氏
微小孔部へ Sn-Cu めっきをした膜の結晶構造評価、応力評価	早稲田大学 齋藤美紀子氏
機能性有機超薄膜の構造解析	株式会社リコー 加藤拓司氏
アモルファス化合物の XAFS 測定	九州工業大学 古曳重美氏
放射光利用による蛋白質結合・含有金属の非破壊分析法開発	九州沖縄農業研究センター 斉藤彰氏
アイオノマー中の Zn 局所構造解析	住友電気工業(株)開発技術研究センター 飯原順次氏
化合物の半導体材料の電子状態解析	住友電気工業(株)開発技術研究センター 飯原順次氏
BL09A による微細パターン形成可能性の検討	松下電器産業株式会社 田村隆正氏
メタクリル樹脂 (PMMA) のプラズマ表面処理前後における組成変化の検出	早稲田大学 篠原秀俊氏
液相合成鉄ベース合金微粒子の耐酸化性解明のための表面敏感 XAFS 測定実験	東北大学 篠田弘造氏
XANES による 6 価クロムの評価	株式会社日産アーク 佐藤成男氏

鉄錯体を含むコロイド結晶の XAFS 測定	九州工業大学 毛利恵美子氏
-----------------------	------------------

1-2 2007 年度

(1) トライアル利用

実験名	実験責任者
小角 X 線散乱による燃料電池プロトン導電膜の構造解析	株式会社住化分析センター
BL09A によるサブミクロン周期構造の形成	松下電器産業株式会社 PAVC 社
SAGA-LS による標準試料中微量元素の蛍光 X 線分析	財団法人九州環境管理協会
ポリエステル繊維に含まれている金属の分析	久光製薬株式会社
リチウムイオン二次電池正極材料の酸素の XAFS 測定	ソニー株式会社
液晶ディスプレイ用配向膜の表面分子配向評価	日産化学工業株式会社電子材料研究所 酒井隆宏氏
化粧品用増粘剤の構造と使用感触との相関性に関する研究	株式会社資生堂 マテリアルサイエンス研究センター
M 型フェライトの結晶構造解析	日立金属株式会社 磁性材料研究所 小林義徳氏
プロトン導電性ペロブスカイト化合物の特異な反応性に関する研究	独立行政法人産業技術総合研究所 ユビキタスエネルギー研究部門 蔭山博之氏

燃焼灰中ホウ素の XAFS 分析	財団法人電力中央研究所
様々な金属酸化物に吸着した金及び白金化学種の XAFS による状態分析	九州大学大学院理学研究院 岡上吉広氏
軟 X 線顕微鏡の開発に向けた化学増幅型フォトリジストの評価	早稲田大学理工学研究院理工学研究所 鷲尾方一氏

(2) ナノテク利用

実験名	実験責任者
X 線吸収分光法による自己組織化酸化物ナノ超格子のナノ構造解析	九州大学大学院総合理工学研究院エネルギー物質科学部門 大瀧倫卓氏
ナノホールメンブレンへ埋め込みを行った Sn, Sn-Cu めっき膜のシンクロトロン放射光による結晶構造、応力評価	早稲田大学・ナノテクノロジー研究所 齋藤美紀子氏
高分子修飾微粒子の微細構造決定	九州工業大学
Fe 酸化物の XAFS 測定と小角散乱測定	九州工業大学
超ナノ微結晶ダイヤモンド薄膜の構造解析	九州大学大学院総合理工学研究院 吉武剛氏
水素チャージを施したオーステナイト系ステンレス鋼の疲労破面におけるマルテンサイト変態相の測定	福岡大学 松永久生氏
リチウムイオン電池用正極材料 (FeF ₃ および VF ₃) の充放電過程における局所構造解析	九州大学先端物質化学研究所 岡田重人氏

異常分散 X 線回折による六方晶 M 型フェライトの結晶構造解析	日立金属株式会社磁性材料研究所 尾田悦志氏
サイズ制御金属ナノ粒子の反応性に関する研究	産業技術総合研究所
SiO ₂ ガラスにおける 0 周りのクラスター構造のメカニズム研究	コバレントマテリアル株式会社 藤森洋行氏
低温直接接合及び親水化処理に関するポリマー表面の分析	早稲田大学大学院先進理工学研究所 篠原秀敏氏
イオン交換法を用いた光選択透過部材の設計	福岡県工業技術センター
PVD セラミックコーティング膜の応力解析	住友電気工業株式会社
高圧水素ガスに暴露したオーステナイト系ステンレス鋼 SUS304 の疲労破面におけるマルテンサイト変態相の測定	福岡大学 松永久生氏
NEXAFS による DLC 膜の構造解析	豊田中央研究所
放射光粉末 X 線回折によるダブルペロブスカイト型酸化物の構造精密化	九州大学大学院総合理工学研究院 大瀧倫卓氏
AI をドーブした ZnO ナノ粒子の局所構造観察	産業技術総合研究所
光電子分光法および軟 X 線吸収分光法による燃料電池用電極触媒の表面状態分析	豊田中央研究所
SiC(0001) 上に形成した酸窒化シリコン 2 重層膜の PES と XANES の測定	九州大学総合理工学研究院 梶原浩氏
超ナノ微結晶ダイヤモンド薄膜の構造解析	九州大学大学院総合理工学研究院 吉武剛氏

シュウ酸金属錯体のプロトン伝導メカニズムの解明	九州大学大学院理学研究院 山田鉄兵氏
-------------------------	--------------------

(3) 公共等利用

実験名	実験責任者
車両用バンパー樹脂の異同識別における放射光蛍光 X 線分析法による微量不純物分析の応用	佐賀大学理工学部

(4) 旧整備チーム利用

実験名	実験責任者
X 線異常散乱効果を用いたソフトマターのマイクロ構造解析	九州大学 副島雄児氏
Te _{0.4} Se _{0.6} 単結晶を用いた X 線異常分散効果測定	九州大学 副島雄児氏

(5) 県試験研究機関利用

実験名	実験責任者
金属酸化物の構造解析	佐賀県工業技術センター
ガラスマトリクス中に溶解及び担持された金属イオンの分析	佐賀県工業技術センター
ガラスマトリクス中に溶解及び担持された金属イオンの分析	佐賀県工業技術センター

2. 研究センター出版物

2-1 2006 年度

(1)応用物理学会（九州支部）・九州シンクロトロン光研究センター合同シンポジウム SAGA シンクロトロンとアカデミアー九州における学術・産学共同利用を目指してー（2006）.

(2)平成 18 年度研究成果報告会実施報告書, (2007) .

2-2 2007 年度

(1) SAGA-LS ナノテクセミナー「ナノテクノロジーと放射光利用」実施報告書（第 6 回九州地区ナノテクノロジー拠点ネットワークセミナー）（2007）.

(2)平成 19 年度研究成果報告会実施報告書（2008）.